



Assing S.p.A. e Labormet Due. in collaborazione con Tescan Orsay Physics e Leica Microsystems hanno il piacere ad invitarla al workshop:

LA MICROSCOPIA OTTICA E LA MICROSCOPIA ELETTRONICA A SCANSIONE (SEM) PER APPLICAZIONI DI RICERCA DI BASE, CARATTERIZZAZIONE E CONTROLLO DI QUALITÀ DEI MATERIALI DALLA MACRO ALLA MICROSCALA.

Programma

9.30 – 10.00: Accoglienza e registrazione partecipanti

10.00 – 10.45: QA e FAILURE ANALYSIS con il microscopio ottico: analisi morfologica e analisi di immagine in luce polarizzata

Relatore: Dr. Giancarlo Parma – Leica Microsystems

10.45 – 11.15: Coffe Break

11.15 – 12.00: Nuovo microscopio elettronico Vega 4: operatività e nuovi flussi di lavoro semplificati per l'analisi morfologica e chimico/elementare dei campioni nella micro/nanoscala

Relatore: Dr. Giuliano Casati Assing S.p.A

12.00 – 14.00: Pausa pranzo presso ISC Bistrot & Caffè

14.00 – 15.00: Suddivisione in due gruppi dei partecipanti e dimostrazione pratica degli strumenti

15.00 -15.30: Coffe Break

15.30 – 16.30: Seconda sessione di dimostrazione pratica degli strumenti



Sede e date

L'evento si terrà nei giorni 11 e 12 Maggio 2022 presso l'Innovation Square Center (ISC), Corso Orbassano 402/15 – Torino (www.isclab.it)

A chi è Rivolto

Tecnici di laboratorio, responsabili del controllo qualità e di analisi dei fallimenti
Aziende del settore metallurgico, automobilistico e dei materiali plastici/compositi in genere

Strumenti Utilizzati

Microscopi Leica DM Series HighEnd con sistema di polarizzazione
Microscopio Elettronico a Scansione (SEM) Tescan Vega 4 con Microanalizzatore EDX Essence

Partecipanti

al fine di garantire una buona interattività nelle sessioni dimostrative il numero di partecipanti è limitato ad un massimo di 10-12 per giornata

Modalità di iscrizione

L'iscrizione dovrà avvenire entro e non oltre Mercoledì 4 Maggio 2022 inviando una e-mail al seguente indirizzo: sales@assing.it, indicando nell'oggetto "Iscrizione workshop ISC" e riportando nel messaggio le proprie generalità e l'azienda di appartenenza